

Mire de Résolution de Microscopie Haute Résolution



High Resolution Microscopy Resolution Target, #37-539

Stock **#37-539** 3-4 JOURS

-

1

+

€1.663⁴⁵

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4
€1.663,45
Qté 5+
€1.580,54
Prix sur Quantité
Demande de Devis
ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Propriétés physiques et mécaniques

10 x10 x1

Dimensions (mm):

	Construction: Stainless Steel, 75 x25 x 1.5mm, microscope slide format
	Motif: Pinholes Diameter: 4µm, 2µm, 1µm, 0.5µm, 0.25µm Line patterns: 58 groups, 7.5 - 3300 lp/mm Line Widths: 66.7µm - 0.152µm
	Tolérance de Motifs: 100nm/cm = 10 ⁻⁵

Propriétés optiques

Fused Silica w/Chrome deposit	Substrat: ☐
Densité Optique OD: OD>7 @ 400nm, 6 @ 550nm, 4.5 @ 750nm, 3.6 @ 1000nm	
Gamme Spectrale: 200 - 2000nm	

Conformité réglementaire

Conforme	Reach 191:
Conforme	RoHS 2015:
Certificate of Conformance: Visionner	

DESCRIPTION PRODUIT

- Petits motifs - 100 nm et 3300 lp/mm
- Fabriquées par lithographie à faisceau d'électrons haute précision
- Modèles négatifs

Les Mres pour la Microscopie Haute Résolution ont été conçues grâce à la méthode de lithographie par faisceau d'électrons haute précision. Les motifs sont gravés sur un substrat en silice fondue de 10 × 10 mm² à large transmission spectrale (DUV-VIS-NIR), sur lequel est appliquée une couche de chrome à haute densité optique. En retirant la couche de chrome, les motifs peuvent atteindre 100 nm. Ces mires fournissent une excellente stabilité dimensionnelle et sont montées sur un porte-lame de microscope en métal. Les motifs négatifs des mires permettent aux structures d'être transparentes, tandis que l'arrière-plan est bloqué par une couche de chrome.

Mire USAF pour la Microscopie Haute Rés.

Les Mres USAF pour la Microscopie Haute Rés. déterminent facilement la limite de résolution d'un objectif et sont constituées de 59 motifs linéaires avec 7,5 à 3300 lp/mm en alignement horizontal et vertical. Ce type de mire présente également 5 sténopés ayant des diamètres de 4,0 à 0,25 µm, ce qui permet d'apporter une description détaillée de l'optique de micro-imagerie.

Mire Étoilée pour la Microscopie Haute Rés.

Les Mres Étoilées pour la Microscopie HaK14ute Rés. sont constituées de 5 étoiles de Siemens. Ces mires ont une particularité ; le centre des étoiles est fabriqué avec précision pour atteindre une largeur minimale de 150 nm. Les mires étoilées sont parfaites pour déterminer la résolution des objectifs de microscope avec des ouvertures numériques très élevées.

Mire Damier pour la Microscopie Haute Rés.

La Mire Damier pour la Microscopie Haute Rés. présente une dimension totale de 9,0 x9,0 mm², avec des carrés de 50 x50 µm². Le damier est idéal pour tester l'inclinaison et la distorsion de l'image, et également pour déterminer la qualité d'image en raison de ses bords droits et nets.

High Res Microscopy USAF Target

High Res Microscopy USAF Targets easily determine the resolution limit of an objective in transmitted light and consists of 59 line patterns with 7.5 to 3300 lp/mm in horizontal and vertical alignment. This target also features 5 pinholes with diameters between 4.0-0.25µm, which allows for detailed characterization of micro-imaging optics.

High Res Microscopy Star Target

High Res Microscopy Star Targets consist of 5 Siemens stars and show the peculiarity that the tapered segments in the center of the stars are precisely manufactured to a minimum width of 150nm. This target is ideal for the determining the resolution of microscope objectives with very high numerical apertures.

High Res Microscopy Checker Board

High Res Microscopy Checker Board features a total size of 9.0 x9.0mm² out of 50 x50µm² squares. The checker board is ideal for testing of image skew and curvature, along with determining image quality due to the straight and sharp edges.